ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дефектоскопы ультразвуковые портативные USM35 X, USM35 X DAC, USM35 X S

Назначение средства измерений

Дефектоскопы ультразвуковые портативные USM35 X, USM35 X DAC, USM35 X S (далее по тексту - дефектоскопы) предназначены для измерения координат и оценки относительных размеров дефектов в сварных соединениях и основном металле трубопроводов, сосудов давления, котлов, транспортных и мостовых конструкций и других объектов, а также для контактного измерения толщины изделий из металлов и сплавов, сохранения и документирования результатов контроля.

Дефектоскопы применяются при осуществлении контроля и диагностики объектов энергетики, транспорта, нефтегазовых и нефтеперерабатывающих комплексов, и других объектов различных секторов экономики.

Описание средства измерений

Принцип действия дефектоскопов основан на возбуждении ультразвуковых колебаний (УЗК) в материале контролируемого объекта и приеме ультразвуковых колебаний, отраженных от дефектов и границ материалов. Принятый сигнал регистрируется и обрабатывается процессором электронного блока. Электронный блок определяет, запоминает и выдает на дисплей параметры сигнала, координаты дефекта или значение толщины. Дефектоскопы обеспечивают различные режимы измерения (от нуля до первого эхо-сигнала, по многократным отражениям, по фронту или пику импульса и пр.), автоматический расчет и индикацию местоположения дефекта при наклонном прозвучивании. Предусмотрена возможность запоминания до 800 блоков данных с изображениями на экране и параметрами настройки, работа с принтером и компьютером.

Дефектоскопы выполнены в виде малогабаритного электронного блока с дисплеем и клавиатурой. К электронному блоку посредством кабеля подсоединяется ультразвуковой преобразователь. Фотография общего вида дефектоскопов приведена на рисунке 1.

Дефектоскопы USM35 X — это приборы в стандартном исполнении предназначенные для решения универсальных задач ультразвукового контроля. В дефектоскопах USM35 X DAC добавлена возможность построения нескольких кривых амплитуда — расстояние (APK) для оценки несплошностей по международным нормам. В дефектоскопах USM35 X S предусмотрено использование оценки дефектов как по кривой амплитуда — расстояние (APK), так и по диаграммам амплитуда-расстояние-диаметр (APД).



Рисунок 1 – Общий вид дефектоскопов

Программное обеспечение

На электронный блок дефектоскопов устанавливается внутреннее программное обеспечение (ПО), виды которого, в зависимости от модификации и измерительных задач, перечислены в таблице 1. ПО выполняют следующие основные функции:

- графический интерфейс
- управление аппаратными ресурсами
- тестирование и контроль аппаратного обеспечения
- графического отображения сигналов на экране дефектоскопа
- расчет и отображения результатов в виде пересчетных значений по заранее предустановленным параметрам, обеспечивая различные режимы измерения полученных сигналов
- графического отображения кривых типа АРД(АРК), ВРЧ и т.д в соответствии с предустановлеными параметрами для оценки результатов по международным стандартам и нормам

Идентификационные признаки ПО дефектоскопов соответствуют данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ПО	Идентификаци- онное наимено- вание ПО	Номер версии (идентифика- ционный но- мер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
1	2	3	4	5
Программа об- работки	USM 35	01.00.20	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу
Программа об- работки	USM 35 D	01.01.20	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу
Программа об- работки	USM 35 DAC	01.10.21	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу
Программа обработки	USM 35 DACD	01.11.21	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу
Программа обработки USM 35 S		01.20.21	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу

1	2	3	4	5
Программа об- работки	USM 35 SD	01.21.21	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу
Программа обработки	USM 35X	01.00.80	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к исполняемому файлу
Программа об- работки	USM 35X D	01.01.80	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу
Программа об- работки	USM 35X DAC	01.10.80	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу
Программа об- работки	USM 35X DACD	01.11.80	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу
Программа об- работки	USM 35X S	01.20.80 01.20.90	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу
Программа об- работки	USM 35X SD	01.21.80	Нет доступа к испол- няемому файлу *	Нет доступа к ис- полняемому файлу

^{*} ПО прошивается в память прибора при изготовлении. Доступ к файловой системе имеют исключительно сервисные инженеры фирмы-производителя.

Защита программного обеспечения дефектоскопов от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню А согласно МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение
Training the property of the p	минус 139;
Номинальные значения установки амплитуды зондирующих им-	минус 216;
пульсов, В	минус 224;
	минус 315
Допускаемое отклонение установки амплитуды зондирующих	
импульсов, %	± 10
	от 0,2 до 1,0;
Пиотоволи поболици на отот МСи	от 0,5 до 4,0;
Диапазоны рабочих частот, МГц	от 0,8 до 8,0;
	от 2 до 20
Диапазон измерения временных интервалов для продольной	от 0,1 до 3500
звуковой волны по стали, мкс	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения вре-	± 1
менных интервалов, мкс	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения ам-	±0,5
плитуды сигнала, дБ	
Диапазон регулировки скорости звука, м/с	от 1000 до 15000
Дискретность установки скорости звука, м/с	1
Диапазон регулировки смещения изображения, мм	от минус 10 до плюс 1000
Диапазон регулировки усиления, дБ	от 10 до 110
Дискретность регулировки усиления, дБ	0,5; 1,0; 2, 6
Допускаемое отклонение установки усиления, дБ	$\pm (0.2 + 0.01 \cdot N),$
	где N – усиление, установ-
	ленное на дефектоскопе, дБ
Разрешающая способность при измерении координат дефектов и	
толщины, мм	
- для расстояний до 99,99 мм;	0,01
- для расстояний от 100 до 999,99 мм;	0,1
- для расстояний свыше 100 мм;	1,0

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения	
координат дефектов, %	± 5
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения	
толщины или глубины залегания дефектов, %	± 5
Габаритные размеры, мм, не более	105 x 255 x 176
Масса с батареями питания, кг, не более	2,2
Питание:	
- от Li-Ion аккумуляторного блока с напряжением, В	от 8,6 до 13
- от сети переменного тока с напряжением, В	от 85 до 265
Потребляемая мощность, Вт	от 5,5 до 8
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от минус 20 до плюс 60
- относительная влажность воздуха, %	до 95 (без конденсации)

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на заднюю панель дефектоскопа способом наклеивания этикетки.

Комплектность средства измерений

Таблица 3

№	Наименование	
1	Электронный блок дефектоскопа	
2	Блок питания с сетевым кабелем	
3	Кейс	1 шт.
4	Ультразвуковые преобразователи типа BS, MBS, KG, KN, KK, GN, GKB, GK, BF, MBF, RHP, GMN, DFR, K-PEN, SEB, MSEB, WB, WK, SWB, SWK, ADP, FDU, SWS, AWS, MWB, MWK, MSW-QC, MSWS, VS, VRY, VSY фирмы GE Sensing & Inspection Technologies GmbH	*
6	Руководство по эксплуатации	1 экз.
7	Методика поверки	1 экз.

^{*} Тип и количество в соответствии с заказом потребителя

Поверка

осуществляется согласно методике поверки «ГСИ. Дефектоскопы ультразвуковые портативные USM35 X, USM35 X DAC, USM35 X S. Методика поверки. МП 69.Д4-11» утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» в январе 2012 г.

Основные средства поверки:

- 1. Генератор сигналов сложной формы AFG 3022. Синусоидальный сигнал от 1 к Γ ц до 20М Γ ц, диапазон напряжений от 10 мB до 10 B, погрешность \pm (1 % от величины + 1 мB), амплитудная неравномерность (до 5 М Γ ц) \pm 0,15 дБ, (от 5 до 20 М Γ ц) \pm 0,3 дБ;
- 2. Осциллограф цифровой Tektronix TDS-2012B. Диапазон измеряемых размахов напряжений импульсных радиосигналов от 10 мB до 10 B. Пределы относительной погрешности измерения напряжений $\pm 3 \text{ %}$;
- 3. Контрольные образцы №2 и №3 из комплекта КОУ-2. Контрольный образец №2: высота 59 мм, боковые цилиндрические отверстия диаметром 2 и 6 мм. Контрольный образец №3: радиус цилиндрической поверхности 55 мм.

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в руководстве по эксплуатации «Дефектоскопы ультразвуковые портативные USM35 X, USM35 X DAC, USM35 X S. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы устанавливающие требования к дефектоскопам ультразвуковым портативным USM35 X, USM35 X DAC, USM35 X S

Техническая документация фирмы GE Sensing & Inspection Technologies GmbH, Германия.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

При осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;

при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма GE Sensing & Inspection Technologies GmbH, Германия.

Robert-Bosch-Str.3, Hürth, Germany, 50354

Телефон: +49 (0) 22 33 - 601 111 Сайт: http://www.ge-mcs.com

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт оптикофизических измерений» (ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИОФИ"), аттестат аккредитации (Госреестр N20003-08) от 30.12.2008.

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46. Телефон: (495) 437-56-33, факс: (495) 437-31-47

E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

			Е.Р. Петросян
ΜП	"	"	2012 г.